

分析走査電子顕微鏡



分析走査電子顕微鏡

日本電子

JSM-6610LA

平成21年度導入 (財) J K A 補助事業



【主な用途・仕様】

無機・有機材料などの表面観察や微小領域の元素組成分析により、不良の原因解析や表面状態観察に使用します。

- ・ 倍率：5～300,000 倍
- ・ 最大試料寸法：直径 200mm
- ・ 観察可能範囲：X125mm、Y100mm
- ・ 試料ステージ：5 軸モータードライブ
- ・ 検出元素範囲： ${}_5\text{B}$ ～ ${}_{92}\text{U}$

【設備使用】

分析走査電子顕微鏡

【委託分析試験】

電子顕微鏡写真

EDS 定性分析 (固体、粉末)